

画像センシング展 2010 にて「スカメラ」2機種を同時発表！

「SET SCAMERA (セット・スカメラ)」発表

「SCAMERA μ HMAP (スカメラ・マイクロハイマップ)」発表

2010年6月8日 ニューリー株式会社

ニューリー株式会社（代表取締役社長 井田敦夫）は、スカメラ新シリーズ（*注1）2機種を画像センシング展 2010（2010年6月9日～6月11日、パシフィコ横浜にて開催）にて同時発表します。

*注釈1)「スカメラ技術」は、2009年7月、第3回ものづくり日本大賞「経済産業大臣賞」を受賞

**【1】汎用向け・ローコストタイプのスカナ「セット・スカメラ」
7000万画素の高画質！セットしてボタンを押すだけワンタッチスキャン！**

■ **特徴**

- 1) 7000万画素 高画質・高精彩スキャン
 - ・ 600dpi縮小光学系を搭載しているため被写界深度が深く、様々な立体物を約7,000万画素の高解像度で高精細に読み取りことができます。
- 2) 原稿をセットしてスタートボタンを押すだけ
 - ・ 原稿テーブルはセットしやすいオープン構造を採用。
 - ・ 照明位置や照射角度を変更できる白色光源を標準装備しているため、ライティングも自由に設定できます。

■ **用途**

- ・ プリント基板などの実装部品目視検査
- ・ 茶器・食品などの商品カタログ撮影
- ・ 厚手の書籍・雑誌などの読み取りに最適



■ **標準価格**

- ・ セットス・カメラ(本体、付属品等)一式； 150万円～

■ **販売計画**

- ・ 50台以上／年

~~~~~本件に関するお問合せ先~~~~~

ニューリー株式会社 〒613-0031 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷125

Tel:0774-43-3011 /Fax:0774-44-9288 /mail: info@newly.co.jp /URL: http://www.newly.co.jp

## 【2】 微細表面検査・金属加工データに最適！「スキャメラ・マイクロハイマップ」 微細な凹凸を高精細に階調表現！ 10 $\mu$ mの高さを測る！微小高さ計測スキャメラ

### ■ 特徴

- 3) 10 $\mu$ m 単位の高さを階調表現
  - ・ 当社オリジナル方式である $\mu$ HMAP(マイクロハイマップ)技術と、Z軸補正機能により、高速測定を実現。さらに歪みのない光学系に加え、Z軸コントロールにより表面形状の微細な凹凸の高さを自動測定します。
  - ・ 高解像度画像から、高深度多点焦点画像を生成してリアル表示を実現。顕微鏡レベルの拡大でありながら広域かつ高品位な画像で、各種検査から加工データ生成まで様々な用途に活用できます。
- 4)  $\mu$ HMAP(マイクロハイマップ)技術による高さ測定
  - ・ 多焦点画像を自動生成して、標準搭載の専用アプリケーションにて 3D画像を生成・表示することができます。
- 5) 最大A4サイズまでの大きな原稿もOK
  - ・ ナロー(短冊)スキャンで最大A4サイズまでの原稿のスキャニングが可能です。

### ■ 用途

- ・ 突起やへこみ等の各種微細表面検査
- ・ 微細な凹凸素材などの金型加工データ作成
- ・ フィルムシートなどの表面形状広域入力



### ■ 標準価格

- ・ スキャメラマイクロハイマップ(本体、付属品等)一式; 2, 200万円

### ■ 販売計画

- ・ 5台以上/年

~~~~~本件に関するお問合せ先~~~~~

ニューリー株式会社 〒613-0031 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷125

Tel:0774-43-3011 /Fax:0774-44-9288 /mail: info@newly.co.jp /URL: http://www.newly.co.jp